

03 июня

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.30-10.40 **К.И. Таперо** – *Председатель Программного комитета*
АО «НИИП»

А.В. Яненко – *Зам. председателя Программного комитета*
АО «ЭНПО СПЭЛС»

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

1. 10.40-11.10 **Ю.Н. Бармаков, В.И. Бутин, А.В. Бутина**
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
К 60-летию юбилею первой межотраслевой конференции по радиационной стойкости
2. 11.10-11.25 **А.В. Согоян^{1,4}, А.А. Демидов^{1,4}, В.А. Кузнецов², А.В. Силаев², К.И. Таперо³, А.С. Петров^{1,3}, В.Д. Калашников^{1,4}, А.Г. Петров⁴, А.В. Уланова^{1,4}, А.С. Артамонов^{1,4}, А.А. Печёнкин^{1,4}, А.П. Смагин², С.И. Козырева², Д.А. Копысов², К.А. Савасичев², М.Г. Бальябин², А.С. Ватуев³, Ю.Б.Деревянко³**
¹НИЯУ МИФИ, ²ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ³АО «НИИП», ⁴АО «ЭНПО СПЭЛС»
Исследование влияния амплитудно-временных характеристик импульсного излучения на уровни отказов ИС
3. 11.25-11.40 **С.В. Митрофанов, П.Ю. Апель, В.В. Бехтерев, Г.Г. Гульбемян, А.С. Забанов, И.А. Иваненко, Н.Ю. Казаринов, И.В. Калагин, В.И. Лисов, Н.Ф. Осипов, В.А. Семин, В.А. Скуратов, И. Франко**
ОИЯИ
Многоцелевой прикладной научный комплекс на базе нового циклотрона ДЦ-140 в ЛЯР ОИЯИ

4. 11.40-11.55 **П.А. Чубунов, А.С. Бакеренков, Г.В. Стародубцов, В.В. Юдин, О.А. Тверитнева, Е.М. Мельник**
 АО «НИИ КП»
 Направления модернизации автоматизированных систем из состава стендов испытаний на воздействие ТЗЧ

11.55-12.10 **ОБЗОР ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ**

12.10-12.45 **Кофе-брейк**

12.45-13.15 **ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ**

5. 13.15-13.30 **В.Ф. Зинченко, Д.Ю. Деревянко**
 АО «Российские космические системы»
 Развитие метода секторирования с целью повышения точности прогнозирования локальных дозовых нагрузок в бортовой аппаратуре
6. 13.30-13.45 **П.Р. Гильванов, А.Е. Козюков, М.В. Кожухов**
 ООО «Прогноз-РС»
 Особенности применения программ расчета локальных поглощенных доз в трехмерной геометрии
7. 13.45-14.00 **Г.А. Протопопов, М.В. Яковлев**
 АО «ЦНИИмаш»
 Обеспечение стойкости малых космических аппаратов к воздействию ионизирующих излучений космического пространства
8. 14.00-14.15 **А.С. Петров, В.В. Емельянов, Р.Г. Усеинов, Д.М. Бакеренкова, М.В. Баньковский, А.Э. Земцов, М.С. Петров, М.А. Тюрников, С.А. Филатов**
 АО «НИИП»
 Оценка показателей стойкости к воздействию нейтронного излучения в части одиночных радиационных эффектов в практике испытаний

14.15-15.30 Перерыв на обед

9. 15.30-15.45 **А.И. Яньков, С.А. Яковлев, Е.В. Мухин**
 ООО «НПП «Детектор»
 Комплексный анализ методик испытаний модулей
 на воздействие ТЗЧ
10. 15.45-16.00 **Г.И. Зебрев¹, Р.Г. Усейнов², А.А. Матейко¹, А.С. Родин¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «НИИП»
 Методология оценки вероятности одиночной защелки
 при воздействии ионов и протонов в космосе
11. 16.00-16.15 **А.Н. Шемонаев, А.А. Аникин, М.В. Литвинова**
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Метод выявления деградационных процессов в
 резисторах поверхностного монтажа к воздействию
 наносекундных импульсных помех
12. 16.15-16.30 **К.А. Чистякова, А.Г. Кузнецов, Д.М. Амбуркин**
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Контроль времени потери работоспособности сложно-
 функциональных СВЧ изделий при импульсном
 ионизирующем воздействии

04 июня

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

13. 10.30-10.45 **Ю.Н. Бармаков, В.И. Бутин, И.В. Бутин**
 ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
 Взаимовлияние радиационных эффектов на метрологические характеристики полупроводниковых детекторов
14. 10.45-11.00 **В.В. Емельянов, А.В. Сиделев, А.Е. Нестеренко**
 АО «НИИП»
 Определение выхода заряда в диоксиде кремния при воздействии гамма-излучения с помощью МНОП-структуры
15. 11.00-11.15 **А.С. Бакеренков, П.А. Чубунов, И.В. Скоркин**
 АО «НИИ КП»
 Дозовые ионизационные эффекты в МОП-приборах при различных интенсивностях облучения в широком диапазоне температур
16. 11.15-11.30 **Г.И. Зебрев, А.А. Матейко**
 НИЯУ МИФИ
 Статистическое моделирование распределения кратностей множественных сбоев в наноразмерной памяти
17. 11.30-11.45 **Р.Г. Усеинов, А.А. Шарапов**
 АО «НИИП»
 Анализ сечений SEL от протонов и нейтронов в КМОП ИС памяти K6R4016V1D-TC10

11.45-12.30 **Кофе-брейк**

18. 12.30-12.45 **А.Н. Егоров^{1,2}, О.Б. Маврицкий^{1,2}, А.А. Печенкин^{1,2}, М.Э. Харченко³, М.С. Холина¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³АО «ВЗПП-С»
 Исследование эффектов в GAN HEMT при многофотонном лазерном возбуждении сквозь подложку
19. 12.45-13.00 **М.М. Иванова¹, Ю.А. Кабальнов¹, А.В. Скупов¹, А.Н. Качемцев²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ²Институт химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девярых РАН
 Радиационная стойкость светоизлучающих и фотоприемных структур на основе гетеро-эпитаксиальных слоев Ge/Si
20. 13.00-13.15 **В.В. Бабешко¹, А.В. Тяжев¹, О.П. Толбанов¹, И.Д. Щербаков¹, А.Н. Зарубин¹, Б.Г. Гольденберг², Л.И. Шехтман²**
¹НИ ТГУ Центр исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике»,
²Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН
 Радиационная стойкость HR-GaAs:Cr сенсоров к воздействию синхротронного и гамма-излучений
21. 13.15-13.30 **С.Н. Аболмасов^{1,2}, А.В. Кочергин², А.С. Титов², Е.И. Теруков^{1,2}, Д.М. Бакеренкова³, А.С. Петров³, К.И. Таперо³**
¹ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ²ООО «НТЦ ТПТ», ³АО «НИИП»
 Радиационная стойкость высокоэффективных кремниевых гетероструктурных солнечных элементов к воздействию ионизирующего излучения космического пространства

13.30-14.45 **Перерыв на обед**

22. 14.45-15.00 **Н.А. Усачев^{1,2}, Г.О. Чернышев^{1,2}, Д.И. Сотсков^{1,2}, В.Н. Котов^{1,2}, А.В. Телец¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 АЗВ5 СВЧ интегральные схемы приемопередающих трактов систем связи специального и доверенного назначения
23. 15.00-15.15 **М.Е. Артемов¹, Т.Ш. Комбаев²**
¹АО «НПО Лавочкина», ²Филиал АО «НПО Лавочкина»
 Лунный кубсат – оценка дозовой нагрузки на бортовую аппаратуру
24. 15.15-15.30 **М.В. Анохин, А.К. Малков, А.Г. Шилло**
 ИКИ РАН
 Использование инженерного индекса космической погоды для мониторинга радиационной опасности в условиях космического полета
25. 15.30-15.45 **Г.А. Протопопов, К.Д. Задорожный, П.А. Чубунов, И.А. Тужикова, Д.Н. Задорожко**
 АО «НИИ КП»
 Развитие наземного сегмента отраслевой системы мониторинга воздействия ионизирующих излучений космического пространства на радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов
26. 15.45-16.00 **В.А. Фелицын, А.С. Бакеренков, П.А. Чубунов**
 АО «НИИ КП»
 Бортовая система регистрации воздействия ИИ КП на радиоэлектронную аппаратуру

16.00-16.15 **Дискуссия. Предложения в Решение конференции**

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

- С1 Е.В. Власенков, Н.М. Хамидуллина**
АО «НПО Лавочкина»
К вопросу о контроле дозового радиационного воздействия на борту космических аппаратов с применением штатных цифровых датчиков температуры
- С2 М.М. Иванова¹, Ю.А. Кабальнов¹, А.В. Скупов¹, А.Н. Качемцев²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ²Институт химии высокочистых веществ имени Г.Г. Десятых РАН
Радиационная стойкость светоизлучающих и фотоприемных структур на основе гетеро-эпитаксиальных слоев Ge/Si
- С3 В.В. Бабешко, С.Е. Луконин**
НИ ТПУ
Исследование эффекта восстановления работоспособности операционных усилителей при воздействии ионизирующего излучения
- С4 В.В. Бабешко¹, А.В. Тяжев¹, О.П. Толбанов¹, И.Д. Щербаков¹, А.Н. Зарубин¹, Б.Г. Гольденберг², Л.И. Шехтман²**
¹НИ ТГУ Центр исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике», ²Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН
Радиационная стойкость HR-GaAs:Cr сенсоров к воздействию синхротронного и гамма-излучений
- С5 В.Ф. Зинченко, Д.Ю. Деревянко**
АО «Российские космические системы»
Развитие метода секторирования с целью повышения точности прогнозирования локальных дозовых нагрузок в бортовой аппаратуре
- С6 П.С. Черников**
АО «НПО Лавочкина»
Алгоритмы расчета частоты одиночных эффектов, вызываемых ионизирующим излучением космического пространства и бортовых радиоизотопных источников, с учетом реальной конфигурации КА
- С7 А.И. Яньков, С.А. Яковлев, Е.В. Мухин**
ООО «НПП «Детектор»
Комплексный анализ методик испытаний модулей на воздействие ТЗЧ
- С8 Э.Н. Вологдин, В.Г. Малкиэль, О.Л. Сыров**
АО «НПП «Пульсар»
Анализ методов оценки радиационной стойкости полупроводниковых приборов новых разработок на примере нитрид-галлиевых СВЧ полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов

- С9 Г.А. Протопопов, М.В. Яковлев**
 АО «ЦНИИмаш»
 Обеспечение стойкости малых космических аппаратов к воздействию ионизирующих излучений космического пространства
- С10 И.С. Гвоздев, Г.А. Протопопов**
 АО «ЦНИИмаш»
 Оценка частоты одиночных сбоя в реальном времени по данным бортовых измерений потоков заряженных частиц
- С11 Е.Н. Некрасова¹, Т.Б. Мавлюдов²**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²АО «НИИП»
 Оценка дозовых полей тормозного излучения от импульсных ускорителей электронов
- С12 М.В. Анохин, А.К. Малков, А.Г. Шилло**
 ИКИ РАН
 Использование инженерного индекса космической погоды для мониторинга радиационной опасности в условиях космического полета
- С13 В.В. Бибикова¹, А.С. Пузанов¹, А.А. Печенкин², С.В. Оболенский¹**
¹Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седякова», ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследование одиночных радиационных эффектов в интегральных микросхемах с использованием лазерной установки
- С14 Г.И. Зебрев¹, Р.Г. Усейнов², А.А. Матейко¹, А.С. Родин¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «НИИП»
 Методология оценки вероятности одиночной защелки при воздействии ионов и протонов в космосе
- С15 Г.И. Зебрев, А.А. Матейко**
 НИЯУ МИФИ
 Статистическое моделирование распределения кратностей множественных сбоев в наноразмерной памяти
- С16 Д.М. Бакеренкова, А.С. Петров**
 АО «НИИП»
 Определение параметров гексагональных МОП-транзисторов
- С17 Д.М. Бакеренкова, А.С. Петров**
 АО «НИИП»
 Влияние изменения коэффициентов лавинного умножения МОП-транзисторов на стойкость к электростатическому разряду

- С18 Д.М. Бакеренкова, М.В. Баньковский, А.С. Петров**
 АО «НИИП»
 Исследование возникновения одиночных радиационных эффектов в мощных МОП-транзисторах при воздействии нейтронов и протонов
- С19 М.А. Тюрников, М.С. Петров, А.С. Петров**
 АО «НИИП»
 Исследование одиночных радиационных эффектов в микросхемах статических ОЗУ при воздействии нейтронов и протонов
- С20 А.Э. Земцов, С.А. Филатов, А.С. Петров**
 АО «НИИП»
 Исследование одиночных радиационных эффектов в микросхемах флэш памяти с архитектурой NAND при воздействии нейтронов и протонов
- С21 А.С. Петров, В.В. Емельянов, Р.Г. Усеинов, Д.М. Бакеренкова, М.В. Баньковский, А.Э. Земцов, М.С. Петров, М.А. Тюрников, С.А. Филатов**
 АО «НИИП»
 Оценка показателей стойкости к воздействию нейтронного излучения в части одиночных радиационных эффектов в практике испытаний
- С22 Р.Г. Усеинов, В.В. Емельянов, А.С. Петров, М.А. Тюрников**
 АО «НИИП»
 Интерпретация экспериментальных данных по сечениям одиночных сбоев в ИС КМОП СОЗУ и оценка частот сбоев от нейтронов в широком интервале энергий
- С23 Р.Г. Усеинов, А.А. Шарапов**
 АО «НИИП»
 Расчет сечений и частот одиночных сбоев от нейтронов различного энергетического спектра с использованием программы GEANT4 и BGR метода на основе экспериментальных сечений от ТЗЧ
- С24 А.А. Шарапов, П.В. Рубанов, А.С. Ватуев**
 АО «НИИП»
 Учет рассеяния пучков частиц при расчете локальных дозовых нагрузок
- С25 А.С. Ватуев, А.А. Сафьянов, А.Н. Махиня, А.К. Липский**
 АО «НИИП»
 Особенности проведения испытаний высоковольтных диодов на моделирующих установках АО «НИИП»

- С26 И.А. Бусыгина^{1,2}, П.Ю. Наумов^{1,2}, Г.Х. Салахутдинов^{1,2}, Н.В. Юрков^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИЯУ МИФИ
 Спектрометрия изотопных источников гамма-излучения методом фильтров поглощения
- С27 И.А. Бусыгина^{1,2}, П.Ю. Наумов^{1,2}, Г.Х. Салахутдинов^{1,2}, Н.В. Юрков^{1,2}**
¹АО «НИИП», ²НИЯУ МИФИ
 Методы регистрации рентгеновского излучения импульсных источников. Создание комплексов спектрометров для исследования импульсного рентгеновского излучения
- С28 Р.С. Плишко, Ю.С. Лойко, И.А. Бусыгина**
 АО «НИИП»
 Определение характеристик электронного поля установки АРСА, работающей в режиме вывода электронов
- С29 А.В. Кириллов, И.Н. Микулин, Д.М. Иващенко**
 АО «НИИП»
 Модернизация устройства запуска разрядников батареи магнитного поля и генератора ГИН-100 на установке ЛИУ-10
- С30 Д.М. Иващенко, В.В. Кочергин, А.К. Липский, А.Н. Махиня, А.А. Сафьянов**
 АО «НИИП»
 Экспериментальные исследования и оптимизация компактного генератора одиночных импульсов напряжения
- С31 Д.М. Иващенко, В.В. Кочергин, А.К. Липский, А.Н. Махиня, А.А. Сафьянов**
 АО «НИИП»
 Компактный датчик для измерения единичных импульсов тока
- С32 Е.В. Тулисов, А.Б. Гирко, И.В. Медведев, П.В. Боголюбова, И.А. Бусыгина, В.А. Рахимова, А.В. Кириллов, И.А. Алексеев**
 АО «НИИП»
 Формирование полей тормозного излучения в полезном испытательном объёме помехозащищённого комплекса установки ЛИУ-10 магнитным полем изменённого выводного устройства
- С33 А.А. Мысовский**
 АО «НИИП»
 Ретроспективный обзор испытательной базы АО «НИИП» и концепции по выводу из эксплуатации данных исследовательских ядерных установок
- С34 А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}, И.В. Скоркин¹**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Дозовые ионизационные эффекты в МОП-приборах при различных интенсивностях облучения в широком диапазоне температур

- С35 А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Проектирование устройства уменьшения энергии ионов для испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ
- С36 В.В. Юдин^{1,2}, А.С. Бакеренков^{1,2}, Г.В. Стародубцов¹, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Программная автоматизация подсчета флюенса тяжелых заряженных частиц по трековым детекторам на основе полимерных пленок
- С37 В.А. Фелицын¹, А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Бортовая система регистрации характеристик ТЗЧ
- С38 В.А. Фелицын¹, А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Бортовая система оперативной оценки дозовой нагрузки на основе р-канальных МОП-транзисторов
- С39 Г.В. Стародубцов¹, А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Оптимизация технологии определения флюенса ТЗЧ с использованием полимерных трековых детекторов
- С40 О.А. Тверитнева^{1,2}, А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Автоматизированная система позиционирования объекта испытаний при воздействии ТЗЧ
- С41 Е.М. Мельник^{1,2}, А.С. Бакеренков^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}**
¹АО «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ
 Автоматизированная система задания энергии ТЗЧ на основе набора деградированных
- С42 Н.В. Бондаренко, М.С. Мальцева, М.С. Кузнецов, Н.А. Вавичкин, П.А. Чубунов**
 АО «НИИ КП»
 Зависимость результатов испытаний на стойкость к воздействию ТЗЧ от накопленной дозы для п-канального МОП-транзистора
- С43 Н.О. Безруков, В.В. Лыков, А.И. Цветков, П.А. Чубунов, Б.К. Шамсутдинов**
 АО «НИИ КП»
 Оптимизация временных затрат на отработку схем защиты от тиристорного эффекта с использованием лазерного воздействия

- С44 Г.А. Протопопов, К.Д. Задорожный, П.А. Чубунов, И.А. Тужикова, Д.Н. Задорожко**
 АО «НИИ КП»
 Развитие наземного сегмента отраслевой системы мониторинга воздействия ионизирующих излучений космического пространства на радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов
- С45 К.А. Чистякова^{1,2}, А.Г. Кузнецов^{1,2}, Д.М. Амбуркин^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Аппаратно-программный комплекс контроля времени потери работоспособности сложно-функциональных СВЧ-изделий
- С46 И.О. Лоскутов^{1,2}, В.А. Марфин², Д.В. Бобровский^{1,2}, А.С. Каменева^{1,2}, Л.Н. Кессаринский^{1,2}, А.Б. Боруздина^{1,2}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Случаи выявления контрафактных микросхем при проведении расчетно-экспериментальной оценки стойкости
- С47 Н.А. Усачев^{1,2}, Г.О. Чернышев^{1,2}, Д.И. Сотсков^{1,2}, В.Н. Котов^{1,2}, А.В. Телец¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 АЗВ5 СВЧ интегральные схемы приемопередающих трактов систем связи специального и доверенного назначения
- С48 А.Н. Шемонаев^{1,2}, А.А. Аникин^{1,2}, М.В. Литвинова²**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Метод выявления деградационных процессов в резисторах поверхностного монтажа к воздействию наносекундных импульсных помех
- С49 А.В. Яненко^{1,2}, В.П. Лукашин^{1,2}, Г.С. Сорокоумов^{1,2}, Е.А. Дудоров³, Б.Г. Колбасин³, А.Е. Козюков^{2,4}**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³АО «НПО «Андроидная техника»,
⁴ООО «Прогноз-РС»
 Организация испытаний электронных модулей на стойкость к воздействию ВЭП в части ОРЭ отказов и сбоев на базе ускорителя протонов
- С50 А.Н. Егоров^{1,2}, О.Б. Маврицкий^{1,2}, А.А. Печенкин^{1,2}, М.Э. Харченко³, М.С. Холина¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³АО «ВЗПП-С»
 Исследование эффектов в GaN HEMT при многофотонном лазерном возбуждении сквозь подложку
- С51 М.С. Бердо, С.Б. Шмаков, И.И. Швецов-Шиловский, А.Г. Петров**
 НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Детектирование электронного излучения высокой мощности дозы с помощью лавинного диода

- С52 А.Р. Мустафин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Развитие методов контроля катастрофических отказов во вторичных источниках питания при воздействии ТЗЧ
- С53 Д.В. Бобровский, А.А. Печенкин, А.В. Сокоян**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Совместное воздействие протонного и импульсного ионизирующего излучений
- С54 Е.Ю. Внукова, Д.В. Котова, Г.В. Чуков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Проявление «оконных эффектов» при стационарном дозовом воздействии
- С55 О.А. Герасимчук¹, А.И. Чумаков^{1,2}**
¹*НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»*
 Оценка уровня бессбойной работы ИС для произвольной длительности импульса по результатам воздействий короткого импульса
- С56 А.И. Чумаков^{1,2}, Д.В. Бобровский^{1,2}**
¹*НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»*
 Возможности изменения значений линейных потерь высокоэнергетичных ионов на стенде «ИСКРА»
- С57 Д.В. Бобровский^{1,2}, А.И. Чумаков^{1,2}, С.А. Соловьев^{1,2}**
¹*НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»*
 Особенности проведения экспериментальных исследований на импульсном пучке ионов стенда «СОЧИ»
- С58 Р.С. Торшин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Эффект усиления дозы в микросхемах ЦАП/АЦП
- С59 П.Л. Пармон¹, Е.В. Гусаров¹, А.С. Грошев¹, К.В. Зольников¹, Т.В. Скворцова²**
¹*АО «НИИЭТ», ²ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*
 Алгоритм анализа тестопригодности микросхем с учетом радиационного воздействия
- С60 П.Л. Пармон¹, Е.В. Гусаров¹, А.С. Грошев¹, В.В. Котляров², В.К. Зольников², А.С. Кравченко²**
¹*АО «НИИЭТ», ²ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»*
 Многобитная отказоустойчивая память

- С61 П.Л. Пармон¹, Е.В. Гусаров¹, Е.В. Грошева¹, В.К. Зольников², А.С. Ягодкин²**
¹АО «НИИЭТ», ²ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»
 Функционально-логическое моделирование и генерация тестов базовых элементов микросхем
- С62 Ю.Н. Бармаков¹, В.И. Бутин^{1,2}, И.В. Бутин¹**
¹ФГУП «ВНИИА им. Н.П. Духова», ²НИЯУ МИФИ
 Взаимовлияние радиационных эффектов на метрологические характеристики полупроводниковых детекторов
- С63 Ю.Н. Бармаков, А.В. Бутин, А.В. Бутина**
 ФГУП «ВНИИА им. Н.П. Духова»
 Технология моделирования пороговой ионизационной реакции полупроводниковых приборов с использованием макропараметров диффузионно-дрейфовой модели диодных структур
- С64 П.Р. Гильванов, А.Е. Козюков, М.В. Кожухов**
 ООО «Прогноз-РС»
 Особенности применения программ расчета локальных поглощенных доз в трехмерной геометрии
- С65 О.В. Ткачев, А.А. Ступаков, А.С. Кустов**
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
 Исследование реакции динамических ОЗУ на воздействие нейтронного, протонного и гамма-излучений
- С66 С.Н. Аболмасов^{1,2}, А.В. Кочергин², А.С. Титов², Е.И. Теруков^{1,2}, Д.М. Бакеренкова³, А.С. Петров³, К.И. Таперо³**
¹ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ²ООО «НТЦ ТПТ», ³АО «НИИП»
 Радиационная стойкость высокоэффективных кремниевых гетероструктурных солнечных элементов к воздействию ионизирующего излучения космического пространства
- С67 О.И. Рабинович¹, Е.И. Кобзев¹, В.В. Боричок¹, А.А. Савчук¹, В.О. Атюнин¹, М.Н. Орлова¹, Ю.В. Осипов¹, И.В. Борзых¹, А.Э. Земцов^{1,2}**
¹НИТУ МИСИС, ²АО «НИИП»
 Изучение деградации параметров нитридных светодиодов при высокоэнергетическом облучении

Участники конференции «Стойкость-2025»

Ф.И.О.	Должность	Место работы
1. Азовцев Егор Андреевич	Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
2. Амбуркин Дмитрий Михайлович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
3. Амбуркин Константин Михайлович	Научный сотрудник / Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
4. Андреянов Денис Александрович	Инженер-исследователь 1 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
5. Аникин Андрей Александрович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
6. Анисимов Олег Владимирович	Начальник ТКБ	АО «УКБП» г. Ульяновск
7. Анохин Михаил Всеволодович	Зав. лаборатории	СКБ КП ИКИ РАН г. Таруса
8. Артемов Михаил Евгеньевич	Ведущий инженер-конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки
9. Артюхова Майя Александровна	Ведущий инженер	АО «НПП «Радар ммс» г. Санкт-Петербург
10. Бабешко Владислав Вадимович	Инженер	НИ ТПУ г. Томск
11. Баженов Алексей Сергеевич	Начальник лаборатории	АО «НПЦ «Полус» г. Томск
12. Бакеренков Александр Сергеевич	Ведущий научный сотрудник	АО «НИИ КП» г. Москва
13. Бакеренкова Диана Максимовна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
14. Балкин Михаил Сергеевич	Менеджер	ООО «Остек-ЭК» г. Москва
15. Балуев Арсений Андреевич	Инженер 2 категории	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
16. Баньковский Максим Владимирович	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
17. Батаева Мария Анатольевна	Младший научный сотрудник ЦВЭиЭ	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
18. Безруков Никита Олегович	Инженер-исследователь	АО «НИИ КП» г. Москва
19. Белова Майя Павловна	Ведущий инженер-испытатель	ООО «Бюро 1440» г. Москва
20. Бибикова Вероника Валентиновна	Начальник группы	НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород

21.	Бобровский Дмитрий Владимирович	Директор центра / Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
22.	Боголюбова Полина Владимировна	Инженер климатико- механического комплекса	АО «НИИП» г. Лыткарино
23.	Большаков Андрей Александрович	Заместитель генерального директора по научно- техническим разработкам - главный конструктор по направлению	АО «НИИ ТМ» г. Санкт-Петербург
24.	Боруздина Анна Борисовна	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
25.	Бублик Михаил Анатольевич	Ведущий научный сотрудник	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
26.	Бусыгина Ирина Алексеевна	Начальник отдела метрологии ионизирующих излучений	АО «НИИП» г. Лыткарино
27.	Бутин Алексей Валентинович	Инженер	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
28.	Бутин Валентин Иванович	Начальник научно-исследова- тельского отделения, д.т.н.	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
29.	Васильев Павел Николаевич	Менеджер	ООО «Остек-ЭК» г. Москва
30.	Васькин Роман Евгеньевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
31.	Вильданова Наиля Ревхадовна	Ведущий инженер-конструктор	АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара
32.	Вовк Оксана Валерьевна	Патентовед 1 категории	МОКБ «Марс» - филиал ФГУП «ВНИИА» г. Москва
33.	Гвоздев Иван Сергеевич	Инженер	АО «ЦНИИмаш» г. Королев
34.	Гильванов Павел Ринатович	Владелец продукта	ООО «Прогноз-РС» г. Москва
35.	Голубев Олег Романович	Инженер-механик	АО «НИИП» г. Лыткарино
36.	Горелов Андрей Александрович	Заместитель начальника отдела ЦВЭиЭ	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
37.	Губаревич Леонид Игоревич	Ведущий инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
38.	Давыдов Георгий Георгиевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
39.	Дергачев Антон Геннадьевич	Ведущий инженер	ООО «Бюро 1440» г. Москва
40.	Дианков Сергей Юрьевич	Начальник лаборатории ЦВЭиЭ	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
41.	Дренин Андрей Сергеевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва

42.	Дрижанов Алексей Васильевич	Начальник отдела	АО «НПЦАП» г. Москва
43.	Дрокин Артем Алексеевич	Инженер-испытатель 1 категории	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
44.	Егоров Андрей Николаевич	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
45.	Емельянов Владимир Владимирович	Главный научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
46.	Епифанцев Константин Алексеевич	Инженер-исследователь	НИЯУ МИФИ г. Москва
47.	Жукова Елизавета Борисовна	Ведущий инженер	ФГУП «ЦНИИХМ» г. Москва
48.	Зебрев Геннадий Иванович	Профессор, д.т.н.	НИЯУ МИФИ г. Москва
49.	Земцов Артем Эдуардович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
50.	Зинченко Владимир Фёдорович	Главный научный сотрудник	АО «Российские космические системы» г. Москва
51.	Иванова Наталья Викторовна	Техник 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино
52.	Иващенко Дмитрий Михайлович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
53.	Игнатьева Алина Евгеньевна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
54.	Кабальнов Юрий Аркадьевич	Ведущий научный сотрудник	НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
55.	Калашников Владислав Дмитриевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
56.	Калашникова Анастасия Андреевна	Инженер группы «Сертификация»	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
57.	Кандрунин Владимир Евгеньевич	Главный специалист по ЭКБ	АО «НПК «СПП» г. Москва
58.	Карпухин Владимир Михайлович	Ведущий инженер	АО «ПНИЭИ» г. Пенза
59.	Кессаринский Леонид Николаевич	Директор Центра «Приборотека»	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
60.	Кириллов Алексей Владимирович	Начальник управления ускорителей	АО «НИИП» г. Лыткарино
61.	Кириллов Дмитрий Владиславович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
62.	Клюшкина Валерия Павловна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
63.	Кожухов Максим Владимирович	Руководитель группы	ООО «Бюро 1440» г. Москва
64.	Козюков Александр Евгеньевич	Генеральный директор / Заместитель технического директора	ООО «Прогноз-РС» / АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва

65.	Копотиллов Вадим Геннадьевич	Инженер 2 категории	АО «НИИ ТП» г. Москва
66.	Копылов Валерий Андреевич	Заместитель начальника отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
67.	Коротков Александр Андреевич	Советник отдела сопровождения радиационных испытаний ЭКБ	Госкорпорация «Росатом» г. Москва
68.	Костюченко Денис Сергеевич	Инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
69.	Котов Владислав Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
70.	Котова Дарья Витальевна	Руководитель лаборатории	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
71.	Кочергин Владимир Васильевич	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
72.	Кузнецов Александр Геннадьевич	Руководитель лаборатории	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
73.	Кузнецов Михаил Сергеевич	Ведущий инженер	АО «НИИ ТП» г. Москва
74.	Кузьмин Иван Олегович	Ведущий инженер	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
75.	Ладин Сергей Валерьевич	Инженер по надежности и радиационной стойкости	АО «Морион» г. Санкт-Петербург
76.	Литвицкий Константин Владимирович	Ведущий инженер	АО «Российские космические системы» г. Москва
77.	Лойко Юрий Сергеевич	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
78.	Лоскутов Илья Олегович	Руководитель группы «Сертификация»	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
79.	Лукашин Владислав Павлович	Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
80.	Мавлюдов Тимур Булатович	Инженер-электроник	АО «НИИП» г. Лыткарино
81.	Маврицкий Олег Борисович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / НИЯУ МИФИ г. Москва
82.	Марфин Владимир Александрович	Научный сотрудник, группа «Сертификация»	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
83.	Матейко Александр Андреевич	Инженер	НИЯУ МИФИ г. Москва
84.	Махиня Алексей Николаевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
85.	Метревели Алексей Александрович	Инженер-исследователь	НИЯУ МИФИ г. Москва
86.	Мещуров Олег Викторович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино

87.	Минзарипов Станислав Рафаэлевич	Инженер 2 категории	АО «СНИИП» г. Москва
88.	Митин Евгений Викторович	Начальник отдела радиационных и ресурсных испытаний	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
89.	Митрофанов Семен Вячеславович	Заместитель главного инженера	ЛЯР им. Г.Н. Флерова ОИЯИ г. Дубна
90.	Мрозовская Елизавета Владимировна	Инженер 1 категории	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
91.	Мурзин Вадим Юрьевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва
92.	Мурысин Сергей Викторович	Главный специалист	АО «АВЗКС» г. Москва
93.	Мусалитин Александр Александрович	Старший научный сотрудник	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
94.	Мустафин Андрей Рушанович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
95.	Мухин Евгений Вячеславович	Инженер	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
96.	Некрасова Екатерина Николаевна	Начальник группы радиационных испытаний	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
97.	Никоноров Виталий Валериевич	Инженер 1 категории	АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург
98.	Новикова Алёна Александровна	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
99.	Новикова Марина Михайловна	Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
100.	Озеров Александр Иванович	Руководитель проектов	АО «НИИП» г. Лыткарино
101.	Пагава Леонид Леонидович	Заместитель директора по качеству - Главный метролог	АО МНПК «Авионика» г. Москва
102.	Першина Евгения Олеговна	Главный специалист по радиационной стойкости	ООО «Бюро 1440» г. Москва
103.	Петров Александр Сергеевич	Начальник отдела, к.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
104.	Петров Андрей Григорьевич	Руководитель лаборатории / Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
105.	Петров Михаил Сергеевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
106.	Печенкин Александр Александрович	Директор центра / Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
107.	Плишко Роман Станиславович	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
108.	Поздновский Алексей Валерьевич	Ведущий инженер- исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

109.	Посысаев Евгений Иванович	Старший научный сотрудник ЦВЭиЭ	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
110.	Привалов Алексей Александрович	Начальник ТКБ	АО «УКБП» г. Ульяновск
111.	Привалова Анна Михайловна	Инженер-конструктор	АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара
112.	Протопопов Григорий Александрович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЦНИИмаш» г. Королев
113.	Рахимова Виктория Амировна	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
114.	Ревин Сергей Юрьевич	Начальник отдела	АО «РПКБ» г. Раменское МО
115.	Рубанов Павел Владимирович	Начальник управления радиационных испытаний- испытательного центра	АО «НИИП» г. Лыткарино
116.	Савинов Денис Юрьевич	Начальник установки УИН-10	АО «НИИП» г. Лыткарино
117.	Самардакевич Евгений Владимирович	Ведущий инженер- исследователь	АО «НПЦ «Полюс» г. Томск
118.	Сапожник Андрей Михайлович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
119.	Сапожников Вячеслав Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
120.	Сафьянов Алексей Анатольевич	Начальник группы	АО «НИИП» г. Лыткарино
121.	Седнев Вячеслав Владимирович	Начальник ЛСИ	АО «НИИПП» г. Томск
122.	Сидоров Евгений Геннадьевич	Старший инженер	АО НПЦ «ЭЛВИС» г. Зеленоград
123.	Синельщиков Алексей Олегович	Начальник отдела	АО НПЦ «ЭЛВИС» г. Зеленоград
124.	Скоробогатов Михаил Анатольевич	Начальник отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
125.	Скрипов Артем Владимирович	Начальник КБ	АО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург
126.	Согоян Армен Вагоевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
127.	Соловьев Сергей Александрович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
128.	Сорокоумов Георгий Сергеевич	Руководитель лаборатории / Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
129.	Сотсков Денис Иванович	Научный сотрудник / Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
130.	Стародубцов Георгий Владимирович	Инженер-радиоэлектронщик 3 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
131.	Таперо Константин Иванович	Заместитель генерального директора по науке и инновациям, д. т. н.	АО «НИИП» г. Лыткарино

132.	Тараксина Наталья Евгеньевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
133.	Телец Виталий Арсеньевич	Директор	ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
134.	Теруков Евгений Иванович	Заместитель генерального директора	ООО «НТЦ ТПТ» г. Санкт-Петербург
135.	Ткачук Данил Валерьевич	Главный специалист	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
136.	Торшин Роман Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
137.	Тулисов Евгений Викторович	Ведущий инженер установки ЛИУ-10	АО «НИИП» г. Лыткарино
138.	Турбин Денис Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
139.	Тюрников Максим Александрович	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
140.	Уланова Анастасия Владиславовна	Заместитель генерального директора, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
141.	Ульянов Николай Александрович	Главный системный инженер	ООО «Бюро 1440» г. Москва
142.	Усачев Николай Александрович	Директор дизайн-центра	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
143.	Усеинов Рустэм Галеевич	Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
144.	Фелицын Владислав Александрович	Научный сотрудник	АО «НИИ КП» г. Москва
145.	Филиппов Дмитрий Викторович	Начальник НТЦ ПАК	ООО «КВАДРО КОД» г. Самара
146.	Хамидуллина Наталья Мугалимовна	Ведущий математик	АО «НПО Лавочкина» г. Химки МО
147.	Холина Марта Сергеевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
148.	Челенко Роман Михайлович	Ведущий инженер	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна
149.	Черников Павел Сергеевич	Ведущий конструктор	АО «НПО Лавочкина» г. Химки МО
150.	Чернышов Глеб Олегович	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
151.	Чистякова Ксения Алексеевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
152.	Чубунов Павел Александрович	Начальник отделения	АО «НИИ КП» г. Москва
153.	Чудновец Илья Владимирович	Ведущий инженер	АО НПЦ «ЭЛВИС» г. Зеленоград
154.	Чуков Георгий Викторович	Директор центра проведения испытаний	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

155.	Чумаков Александр Иннокентьевич	Главный научный сотрудник / Заместитель директора	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
156.	Шамарин Владимир Вячеславович	Инженер 2 категории	ФГУП «ВНИИА» г. Москва
157.	Шамшурин Роман Вячеславович	Ведущий разработчик	ООО «Бюро 1440» г. Москва
158.	Шарапов Артём Алексеевич	Инженер-исследователь	АО «НИИП» г. Лыткарино
159.	Швецов-Шиловский Иван Иванович	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
160.	Шемонаев Александр Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
161.	Шмаков Сергей Борисович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
162.	Щепанов Андрей Николаевич	Первый заместитель генерального директора по коммерции и программам развития	АО «НИИП» г. Лыткарино
163.	Юдин Владислав Владимирович	Инженер-программист 3 категории	АО «НИИ КП» г. Москва
164.	Юрков Никита Владимирович	Инженер-метролог	АО «НИИП» г. Лыткарино
165.	Яненко Андрей Викторович	Технический директор / Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» / ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
166.	Янченков Максим Юрьевич	Начальник отдела	АО «НИИ ТМ» г. Санкт-Петербург
167.	Яньков Андрей Ильич	Технический директор	ООО «НПП «Детектор» г. Дубна

